

超スマートな次世代社会を支える ソフトエラー研究

令和2年11月17日

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究部門 原子力基礎工学研究センター 環境・放射線科学ディビジョン 放射線挙動解析研究グループ



原子力基礎工学研究センターの使命

原子力エネルギー利用と放射線利用を支える最新の科学技術を 牽引し、原子力開発を支える基礎基盤的技術を研究



<u>国産の</u>放射線輸送計算コード <u>PHITS</u>の開発・応用研究

あらゆる物質中での様々な放射線の挙動を模擬するモンテカルロ計算コード



(国内外で約4,000名のユーザー)



電子機器に生じるソフトエラーとその影響

ソフトエラー (Soft Error)

一次宇宙線

二次宇宙線

地表面

中性子

放射線によって電子機器に生じる一時的な誤動作※ 半導体デバイスの保持データの反転によって生じる。

(※回復不可能な損傷を指すハードエラーに対し、機器自体に損傷がないため「ソフト」エラーと呼ぶ)





Cite) Australian Transport Safety Bureau, "ATSB TRANSPORT SAFETY REPORT," AO-2008-070, 2008. 例2) 飛行機の制御システムの不具合(2008年10月)

フライバイワイヤの 制御システム故障により急降下

<u>数十人の負傷者</u>



報告書では宇宙線の影響である可能性が高いと指摘



loTによる情報収集, AI・人工知能による解析で<u>イノベーション促進</u>



引用) 内閣府HP <u>https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html</u> 等

次世代社会におけるソフトエラーの危険性

■ IoTの普及による電子機器の増加に伴うエラー増加
 ■ 不具合がネットワークを介して他の機器に伝播
 ■ 人の介在しないAI等の不具合による甚大な被害





産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム(OPERA)

~ 安全・安心・スマートな長寿社会実現のための高度なアプリケーション技術の創出 ~

地上で生じるソフトエラー率の評価技術の開発

(最終目標) 国際標準化, 評価のビジネス化

大阪大学, 九州大学, 京都工芸繊維大学, **日本原子力研究開発機構**, 東北大学, J-PARCセンター, 名古屋大学, 高エネルギー加速器研究機構,

(株)ソシオネクスト,(株)日立製作所,HIREC(株),富士電機(株),三菱電機(株),日本システムウエア(株) 東芝デバイス&ストレージ(株),パナソニックデバイスシステムテクノ(株)

(2017~2021年度)

科学研究費 基盤研究(S)

~ ミューオン起因ソフトエラー評価基盤技術:実測とシミュレーションに基づく将来予測~

<u>ミューオン起因</u>のソフトエラーのメカニズム解明

世界に先駆けて新知見を創出し,将来的な影響を見極める!

大阪大学,九州大学,東京大学,日本原子力研究開発機構

(2019~2023年度)



中性子ソフトエラーの評価技術の開発(1)

ソフトエラー - ソフトエラー対策の技術開発の有効性検証に必須
 率評価 - 実環境で使用される電子機器の信頼性の保証

実環境での試験は困難(電子機器を数千台配置,数ヶ月エラー数を計測)
▶ 加速器施設での放射線照射による 加速試験法 が不可欠



多くの中性子照射施設では、地上のソフトエラー率を直接的に測れない。 目標 多様な中性子源を用いたソフトエラー率評価・校正技術の確立



中性子ソフトエラーの評価技術の開発(2)

ソフトエラー率 = \int エラー断面積, $\sigma_{err}(E_n) \times フラックス, <math>\phi(E_n)$ dE_n 未知(デバイスに依存) 既知 10⁻⁶ (cm²/Mbit) $(1/\text{cm}^2/\text{s/MeV})$ 10^{9} .次宇宙線中性子 10⁻⁷ CYRIC (65MeV) J-PARC CYRIC (23MeV) 10⁷ RCNP 10⁻⁸ _きい電荷量 断面積 10^{5} 10⁻⁹ 0.7fC フラックス 10^{3} Ч Н -0.9fC 10⁻¹⁰ 10^{1} 10^{2} 10^{0} 10^{2} 10^{0} 10^{1} 10^{3} 10^{1} 10^{3} 中性子エネルギー (MeV) 中性子エネルギー (MeV) 従来手法 および PHITSシミュレーションで 各加速器施設の中性子フラックス

従来手法 低エネルギー領域のエラー断面積を過小評価する関数を利用
 考案した アイン・ションで詳細に算定
 ・しきい電荷量は1つの中性子照射試験の測定値で決定可能

算定したエラー断面積の比較



中性子ソフトエラーの評価技術の開発(3)

高精度・短時間にソフトエラー率を算出する<u>実用的なモデル</u>を開発



開発したソフトエラー評価技術の応用例

電子機器の最適な設置場所をPHITSシミュレーションで特定!!





ミューオン起因ソフトエラーの研究の取組(1)





二次宇宙線ミューオン起因ソフトエラーの発生メカニズムを解明し ソフトエラー対策を考案する

ミューオン起因ソフトエラーの研究の取組(2)



負ミューオン捕獲反応による ソフトエラー発生の模式図

J-PARC MUSEでのミューオン照射実験結果

<u>負ミューオン捕獲反応</u>がソフトエラーを多く引き起こす事を シミュレーション・実験の双方より<mark>世界で初めて</mark>実証!!

捕獲反応の発生確率・二次イオン生成は原子核種に依存 → <u>材料の選定</u>によってソフトエラー耐性が向上!!



IoTやAIによりイノベーションを創出する次世代社会を迎えるには 安心・安全の観点からソフトエラー率の評価・対策は非常に重要

半導体ソフトエラーの理論・メカニズム解明研究を行う 国内唯一の研究機関として,様々な企業や大学の研究開発に貢献

今後の10年に向けて



過酷な放射線環境下で 長期間運用される電子機器





参考資料 ~ PHITSの概要と特徴 ~



Particle and Heavy Ion Transport code System PHITSとは?

任意の体系中における様々な放射線の挙動を核反応モデル や核データを用いて模擬するモンテカルロ計算コード



入手方法

- PHITS講習会に参加
- ・RISTの原子力コードセンターに依頼 (国内ユーザー, 手数料13,176円)
- ・PHITSホームページから利用申請書を提出(国外ユーザー, 無料)

http://phits.jaea.go.jp/



- 一言語 Fortran (Intel Fortran 11.1, Gfortran 4.71 or later)
- 入力データ形式 任意フォーマットのASCIIコントロールファイル (ユーザーがFortranプログラムを書く必要はない!)

> 幾何形状

- ・任意の3次元体系
- ・2D&3D描画ツール (ANGEL)
- ・入出力支援ソフト (ParaVIEW*, SuperMC**)

▶ 計算できる物理量

ANGELで描画した2D&3Dジオメトリ ParaVIEW

- 粒子フルエンス, 発熱量, 核反応生成粒子 など
- ➤ 出力データ形式 テキストデータ, ヒストグラム, 等高線図
- > プラットフォーム



Windows, Mac, Linux (MPI & OpenMP並列対応)

*ジオメトリやタリー結果を3次元可視化可能 **CAD形式ジオメトリをPHITS入力形式に変換可能



PHITSに組み込まれた物理モデル

| | 中性子 | 陽子・π粒子 (その他の核子) | | 重イオン | µ粒子 | 電子∙ 陽電子 | 光 | ;子 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| _ | 1 TeV | | 1 TeV/u | | 1 TeV | | 1 TeV | |
| w ↑ ↓ | 核内カスケ 3.0 GeV + 🖗 | ード模型 JAM 蒸発模型 GEM | | JAMQMD + GEM | 仮想光子 核反応 | | EPDL97 or EGS5 | 光核反応 |
| | 核内カスケ | ード模型 INCL4.6 | d + | 量子分子 動力学模型 | JAM/ JQMD + GEM | EGS5 | | JAM/ JQMD + GEM + |
| ネルキ | 20 MoV | + 蒸発模型 GEM ₃ | ι ³ He | JQMD | | | | |
| Ĥ | | 1 MeV | α | 10 MeV/u | ATIMA | | | JENDL + |
| 低 | ↑☆ テーダ ライブラリ | 1 keV | | 電離損失 ATIMA | + オリジナル | 1 keV | 1 keV | |
| | 0.01 meV | → イベントジェネレータモード: 核反応による2次粒子を特定可能 | | | ^{ミューオン} 原子生成+ 捕獲反応 | *飛跡構造 解析 1 meV | *水中のみ対応 | |
| PHITSに組み込まれた物理モデルとその適用エネルギー範囲 | | | | | | | | |

モデル及びその適用エネルギー範囲は入力ファイルにて変更可能



10-35

10-36

100

200

Shield thickness (cm)

遮蔽計算

PHITSのベンチマーク

10⁰

10

50

100

Atomic mass number A

核分裂収率

150

300



200

0

0

50

100

Thickness of PMMA (mm)

粒子線治療

10

0

0

2

Depth (mg/cm²)

電子飛程

3

16

150







) J-PARC設計への応用





その他の施設における遮蔽設計の例







粒子線治療やBNCTへの応用

drawn by PHITS+SimpleGEO O. Ploc et al. IEEE Aerospace Conf. (2017) S. Yonai et al. Med Phys. 39, 5028-39 (2012)

5. Yonai et al. Med Phys. 39, 5028-39 (2012 **粒子線治療場の2次散乱線評価**



Tsukuba Plan

Kumada et al. Radiat. Prot. Dosim. 180, 286 (2018)





放射線防護分野への応用





大気圏内の宇宙線挙動解析





WArning System for AVIation Exposure to Solar Energetic Particle

航空機被ばく警報システム:WASAVIES

- 太陽フレアが発生した際の大気圏内における宇宙線フラックス上昇の情報をリアル タイムで発信するシステム
- 大気圏内の宇宙線挙動解析にPHITSを利用



R. Kataoka et al. Space Weather (2018); T. Sato et al. Space Weather (2018)



レーザー駆動イオン加速研究への応用

✓ 高強度レーザーを物質に照射することで発生する電場にてイオンを加速するレーザー駆動小型加速器の開発が世界各地で進められている
 ✓ そのビーム診断系開発や軌道計算、線量評価にPHITSを利用



Y. Sakaki et al. Progress in Nuclear Science and Technology, 4(2) 182-185 (2014) 24



除染効果評価システム CDE

- 除染作業前後の空間線量率の計算から除染効果を評価するソフトウェア
- PHITSを用いて汚染環境中の空間線量率計算に必要なデータベースを作成



http://nsed.jaea.go.jp/josen/ (←ホームページにて無償提供中)







産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム



https://www.jst.go.jp/opera/outline.html



量子アプリ共創コンソーシアム (QiSS)





(一社)量子アプリ社会実装コンソーシアム (QASS)

□ 事業内容

- QiSS成果について、医薬品及び医療機器として承認をめざす等の成果普及事業
- QiSS成果について、宇宙線による半導体誤動作ソフトエラーの評価方法標準化等の成果普及事業
- 上記成果の知財ライセンス及び証明書発行事業
- 放射性医薬品又はその原料の供給事業
- 人材育成ならびに技術普及事業

https://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/~qass/